

# Model QT-50/5601TSR 四点探针面电阻值测试系统

四点探针面电阻值测试系统由5601TSR面电阻测试仪、QT-50手动测试控制台所组成。本系统利用四点探针原理测量出面电阻值/电阻系数；测量材质为晶圆或ITO膜等材料。

测量尺寸可为晶圆或方形尺寸；不用计算即可直接测量出面电阻值数值 $\Omega/\square$ 。系统体积小，重量轻，容易操作，具防静电功能。可选配QT-60大尺寸手动测试控制台，QT-70自动探针测试台或ST-610A掌上型探头进行测量。



QT-50 手动测试台 5601TSR 面电阻测试仪

## 功能特性：

### 5601TSR面电阻测试仪

最大显示	150000(表面电阻 $\Omega/\square$ ) / 33000(一般电阻 $\Omega$ )
采样率	4 samples/sec
显示	六位数, 7段LED(14.2mm)显示
过载指示	"00000" 闪烁
量程选择	自动和手动
过载保护	AC 330Vrms
工作电压	AC90V~264V, 50/60Hz<15VA
操作温度	0~50°C, RH $\leq$ 80%
通讯接口	RS232, RS485
波特率	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
尺寸	208mm(长) x 91mm(高) x 280mm(宽)

### QT-50手动测试控制台

- 手机台压杆臂压下定位功能，助于检测
- 针头压力：外部加法码改变压力50g~500g
- 尺寸：300(长) x 250(宽) x 200(高)mm
- 量测尺寸：半径150mm，(6inch晶圆)
- 重量：7kg

## 应用：

- 太阳能光电材料
- 导电高分子材料
- 透明导电薄膜材料
- ITO膜
- 奈米材料
- 小分子有机发光材料
- 高分子有机发光材料
- 生物芯片涂布材料



### QH-1026探针规格(软针)

- 探针间距：1mm\*4
- 探针接触电阻：150m $\Omega$
- 下针力道介于45g  $\pm$  20%之间
- 最大电流：1000mA
- 针头：
  - 镀铈处理 Sk4 High Carbon Steel
  - 圆头：针头 150 $\mu$ m
  - 尖头：针头<35 $\mu$ m；尖60°
- 重量：53g / 尺寸：25 x 40 x 40mm

# Model QT-50/5601TSR四点探针面电阻值测试系统

## 可提供各式探针台供选择:

### QT-60 手动测试台

- 晶圆尺寸：8"~12" (300mm)
- 方形尺寸：300mm x 300mm
- 尺寸：250(长) x 320(宽) x 170(高)mm

### ST-610A 掌上型探头

- 手持式，按下握把即可测量
- 针头高低间距，轻松测量
- 尺寸：107mm(高)，  
直径：52mm
- 重量：290g



ST-610A 掌上型探头

### QT-SW 标准电阻 Simulate wafer

- 范围：200m Ohm to 5K Ohm
- 可依客户需求订做任一阻值
- 精度：1%
- 标准片直径：76mm
- 可由校正单位出据校正报告供追溯



## 5601TSR表面电阻量程

档位	测试范围	最小解析度	定电流输出	准确度
1500.00mΩ/□	0.01m~1500.00mΩ/□	10μΩ/□	DC 100mA	±0.05%±20digit
15000.0mΩ/□	0.1m~15000.0mΩ/□	100μΩ/□	DC 100mA	±0.02%±10digit
150.000Ω/□	0.001~150.000Ω/□	1mΩ/□	DC 100mA	
1500.00Ω/□	0.01~1500.00Ω/□	10mΩ/□	DC 10mA	
15.0000KΩ/□	0.1~15.0000KΩ/□	100mΩ/□	DC 1mA	
150.000KΩ/□	0.001K~150.000KΩ/□	1Ω/□	DC 100μA	
1500.00KΩ/□	0.01K~1500.00KΩ/□	10Ω/□	DC 10μA	
15000.0KΩ/□	0.1K~15000.0KΩ/□	100Ω/□	DC 1μA	±0.05%±20digit
150.000MΩ/□	0.001M~150.000MΩ/□	1KΩ/□	DC 100nA	

# QUATEK

德仪国际贸易(上海)有限公司

上海:+86-21-64813366 北京:+86-10-82250468  
深圳:+86-755-33815218 成都:+86-18628083232 西安:+86-29-88825124